

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Se](#)**Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

Print FormatYour search matched **1** of **989514** documents.A maximum of **1** results are displayed, **15** to a page, sorted by **Relevance** in **descending** order.

You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text box.

Then click **Search Again**.**Search Again****Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 Using emulations to enhance the performance of parallel architecture***Obrenic, B.; Herbordt, M.C.; Rosenberg, A.L.; Weems, C.C.;*

Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on , Volume: 10 Issue: 10 1999

Page(s): 1067 -1081

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(996 KB\)\]](#) **IEEE JNL**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Se](#)**Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

[Print Format](#)Your search matched **1** of **987604** documents.A maximum of **1** results are displayed, **25** to a page, sorted by **Relevance** in **descending** order.

You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text box.

Then click **Search Again**.[Search Again](#)**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 FTC piles onto standardization Rambus' skullduggery***Stern, W.;*

Micro, IEEE , Volume: 22 Issue: 4 , July-Aug. 2002

Page(s): 6 -7, 86-7

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(459 KB\)\]](#) **IEEE JNL**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) | [Publications/Services](#) | [Standards](#) | [Conferences](#) | [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)>> [See](#)

Welcome to IEEE Xplore®

Your search matched **[0]** of **[989514]** documents.

- ☐ [Home](#)
- ☐ [What Can I Access?](#)
- ☐ [Log-out](#)

Tables of Contents

- ☐ [Journals & Magazines](#)
- ☐ [Conference Proceedings](#)
- ☐ [Standards](#)

Search

- ☐ [By Author](#)
- ☐ [Basic](#)
- ☐ [Advanced](#)

Member Services

- ☐ [Join IEEE](#)
- ☐ [Establish IEEE Web Account](#)
- ☐ [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)

You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one in the text box. Then click search Again.

[Search Again](#)**OR**

Use your browser's back button to return to your original search page.

Results:

No documents matched your query.

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Se](#)

Welcome to IEEE Xplore®

Your search matched **[0]** of **[987604]** documents.

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

[Print Format](#)

You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one the text box. Then click search Again.

memory and refresh and ((fixed or predetermined or

[Search Again](#)**OR**

Use your browser's back button to return to your original search page.

Results:

No documents matched your query.

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

IEEE HOME | SEARCH IEEE | SHOP | WEB ACCOUNT | CONTACT IEEE



Membership Publications/Services Standards Conferences Careers/Jobs

IEEE Xplore®
 RELEASE 1.5

 Welcome
 United States Patent and Trademark Office

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)
[Quick Links](#)

» Adva

Welcome to IEEE Xplore®

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

- 1) Enter a single keyword, phrase, or Boolean expression.
Example: acoustic imaging (means the phrase acoustic imaging plus any stem variations)
- 2) Limit your search by using search operators and field codes, if desired.

Example: optical <and> (fiber <or> fibre) <in> ti

- 3) Limit the results by selecting Search Options.

- 4) Click Search. See [Search Examples](#)

```
memory and refresh and
((fixed or predetermined or
set) <sentence> (cycle or
cycles))
```

Start Search

Clear

Note: This function returns plural and suffixed forms of the keyword(s).

Search operators: <and> <or> <not> <in> [More](#)

Field codes: au (author), ti (title), ab (abstract), jn (publication name), de (index term) [More](#)

Search Options:

Select publication types:

- ☒ IEEE Journals
- ☒ IEE Journals
- ☒ IEEE Conference proceed
- ☒ IEE Conference proceedin
- ☒ IEEE Standards

Select years to search:

From year: All to Pre

Organize search results by

Sort by: Relevance

In: Descending order

List 15 Results per page

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) |
[Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Au](#)

Welcome to IEEE Xplore®

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

Quick Find an Author:

Enter a last name to quickly locate articles by that author.

Note: You may enter a partial name if your are unsure of the spelling.

OR

Select a letter to browse the author list

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)[Beausoleil R. G.](#)[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerts](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.5Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)>> **Au****Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

Quick Find an Author:

Enter a last name to quickly locate articles by that author.



Note: You may enter a partial name if you are unsure of the spelling.

OR

Select a letter to browse the author list

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)Beausoleil R. G.**[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerts](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore®**
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)» [Se](#)**Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ [Home](#)
- ☐ [What Can I Access?](#)
- ☐ [Log-out](#)

Tables of Contents

- ☐ [Journals & Magazines](#)
- ☐ [Conference Proceedings](#)
- ☐ [Standards](#)

Search

- ☐ [By Author](#)
- ☐ [Basic](#)
- ☐ [Advanced](#)

Member Services

- ☐ [Join IEEE](#)
- ☐ [Establish IEEE Web Account](#)
- ☐ [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Print Format](#)Your search matched **1** of **988420** documents.Results are shown **15** to a page, sorted by **publication year** in **descending** order.**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 Run-time reference clustering for cache performance optimization**

Kaplow, W.K.; Szymanski, B.K.; Tannenbaum, P.; Decyk, V.K.;
Parallel Algorithms/Architecture Synthesis, 1997. Proceedings. Second Aizu International Symposium , 17-21 March 1997
Page(s): 42 -49

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(720 KB\)\]](#) **IEEE CNF**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

IEEE HOME | SEARCH IEEE | SHOP | WEB ACCOUNT | CONTACT IEEE



Membership Publications/Services Standards Conferences Careers/Jobs

IEEE Xplore®
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)[Quick Links](#)[» Se](#)**Welcome to IEEE Xplore®**

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

[Print Format](#)Your search matched **3** of **988420** documents.Results are shown **15** to a page, sorted by **publication year** in **descending** order.**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 The implication of different learning styles on the modeling of object oriented systems***Thomas, L.A.;*Software Engineering, 2000. Proceedings of the 2000 International Conference on
11 June 2000

Page(s): 774

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(84 KB\)\]](#) **IEEE CNF****2 The virtual teleworker-experimenting with a remote software engineering environment***Gautier, R.J.; Thomas, L.A.;*

Teleworking and Teleconferencing, IEEE Colloquium on , 1994

Page(s): 9/1 -9/4

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(176 KB\)\]](#) **IEEE CNF****3 Investigation into the causes of browning in EVA encapsulated flat modules***Holley, W.H., Jr.; Agro, S.C.; Galica, J.P.; Thomas, L.A.; Yorgensen, R.S.; Ezri Klemchuk, P.; Lavigne, G.;*

Photovoltaic Energy Conversion, 1994., Conference Record of the Twenty Fourth IEEE Photovoltaic Specialists Conference - 1994, 1994 IEEE First World Conference on , Volume: 1 , 5-9 Dec. 1994

Page(s): 893 -896 vol.1

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(240 KB\)\]](#) **IEEE CNF**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved

Welcome to IEEE Xplore®

- ☐ Home
- ☐ What Can I Access?
- ☐ Log-out

Tables of Contents

- ☐ Journals & Magazines
- ☐ Conference Proceedings
- ☐ Standards

Search

- ☐ By Author
- ☐ Basic
- ☐ Advanced

Member Services

- ☐ Join IEEE
- ☐ Establish IEEE Web Account
- ☐ Access the IEEE Member Digital Library

Quick Find an Author:

Enter a last name to quickly locate articles by that author.



Note: You may enter a partial name if your are unsure of the spelling.

OR

Select a letter to browse the author list

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)[Tomassetti E.](#)[Tomassetti G.](#)[Tomassetti M.](#)**[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) | [ALL](#)**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerts](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2003 IEEE — All rights reserved